

第15回 機器分析基礎セミナー

信州大学基盤研究支援センター 機器分析支援部門

透過電子顕微鏡の基礎と応用 JEM-1400を使ったアプリケーションのご紹介

演者: 濱元 千絵子氏

日本電子株式会社

日時: 2021年7月15日(木) 17:00~18:00

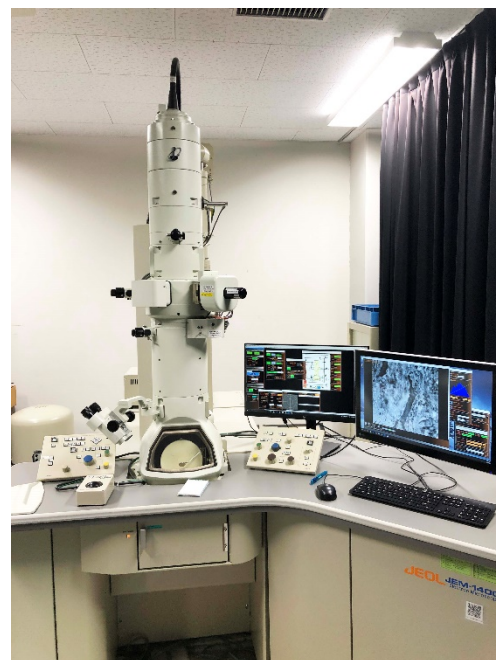
場所: オンライン配信 (Google Meet)

要旨

透過電子顕微鏡(TEM)もコンピューター化が進み、初心者でも簡単に扱えるようになってきました。しかし、より良いデータを取得するためには装置本体の仕組みを理解して使うことが大切です。

本セミナーでは、TEM本体の構造や基本操作を解説すると共に、JEM-1400を使ったアプリケーションをご紹介します。

後日、利用者説明会も予定しております。



参加申込

7月12日までに以下のフォームよりお申込みください。

<https://forms.gle/fwD95mXPKucRMV937>



【お問合せ】

信州大学基盤研究支援センター機器分析支援部門

松本市旭3-1-1

TEL: 0263-37-3097

URL: <http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/kiban/kiki/>

E-mail: kikijimu@shinshu-u.ac.jp